

عنوان مقاله:

تجزیه و تحلیل عوامل بحرانی موفقیت و شکست تحقیق و توسعه فناوری نانو با رویکرد ترسیم نقشه فازی

محل انتشار:

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

شهلا یاسائی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

فرهاد قاسمی - دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

خلاصه مقاله:

آسب شناسی پژوهش های علوم اجتماعی و انسانی نشان می دهد که میزان خطا و ابهام در سنجه ها و ارزیابی های انسانی همواره موجب کاهش اعتبار این پژوهش ها می شود. از این رو، برای رفع این آسیب و عدم اطمینان و ابهام در ارزیابی های انسانی، روش ترسیم نقشه فازی به عنوان رویکردی نوین در تجزیه و تحلیل عوامل معرفتی و استفاده می گردد. در این پژوهش ابتدا عناصر تحقیق و توسعه فناوری نانو در ایران با مطالعه کتابخانه ای شناسایی و سپس با توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه در جامعه مورد نظر شامل مدیران و کارشناسان صنعت در حوزه فناوری نانو و اساتید دانشگاهی این حوزه، شاخص های نهایی شامل 27 عنصر تحقیق و توسعه فناوری نانو در ایران در هفت بعد مجزا شناسایی و تقسیم بندی شد. سپس با استفاده از رویکرد ترسیم نقشه فازی عوامل بحرانی موفقیت و شکست این عناصر معرفی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که مهمترین عامل بحرانی موفقیت ایجاد آگاهی عمومی در حوزه فناوری نانو و مهمترین عوامل بحرانی شکست ایجاد تعامل بین محققان و مهندسان، پیشنهاد راهبردهای تحقیق و توسعه برای دولت، و ارتباط بین صنعت و دانشگاه است.

کلمات کلیدی:

نقشه فازی، عوامل بحرانی موفقیت، عوامل بحرانی شکست، تحقیق و توسعه، فناوری نانو

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/189110>

